

Székely: Kétféle mérési eljárás

13:45 Boda Krisztina

Két mérési eljárás egyezésének vizsgálatára alkalmas statisztikai módszerek  
ismételt mérések esetén

14:00 Rárosi Ferenc

Mintaelemszám becslése logisztikus regressziós modellben

14:15 Hulmán Ádám, Nyári Tibor, Karsai János

Longitudinális adatok interaktív vizualizációja és elemzése nem-paraméteres  
módszerekkel

14:30

Ungvári Tímea, Nagy Attila, Sipos Valéria, Szöllősi Gergő József, Vincze Ferenc, Kovács Nóra,  
Pálinkás Anita, Földvári Anett, Sándor János

Diabeteses betegek klinikai adatbázisa

14:45 Dinya Elek

Big-data adatbázis a jövő kihívása

15:00 Vassányi István, Juhász Zoltán, Kozmann György

Epilepsziás gócpontok interaktív lokalizálását támogató szoftver környezet

15:15 Zárás